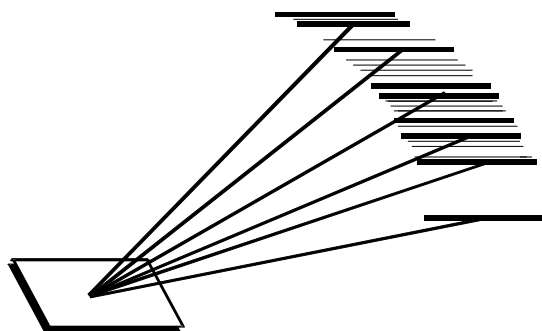


Deutscher Arbeitskreis für Angewandte Spektroskopie

ISAS

Institute for
Analytical
Sciences



19. Anwendertreffen
Röntgenfluoreszenz-
und
Funkenemissionsspektrometrie

Dortmund
6. - 7. März 2012

Der Deutsche Arbeitskreis für Angewandte Spektroskopie (DASp) veranstaltet gemeinsam mit der Universität Duisburg-Essen, der Fachhochschule Münster, der Universität Hamburg und dem ISAS - Institute for Analytical Sciences ein Treffen von Anwendern der Röntgenfluoreszenz- und Funkenemissionsspektrometrie sowie verwandter Methoden der Feststoffanalytik. Ziel des Anwendertreffens ist es, Forschung und Industrie zusammenzuführen, um den Informationsaustausch zu fördern und neue Entwicklungen anzuregen. In Kurzvorträgen wird über instrumentelle Neuentwicklungen, Lösungen aktueller Fragestellungen und insbesondere über den Einsatz dieser Methoden in Laboratorien verschiedenster Bereiche der Industrie berichtet.

Tagungsort und Termin
6. bis 7. März 2012
Universität Dortmund
ISAS - Institute for Analytical Sciences
Otto-Hahn-Straße

Organisation

Prof. Dr. J.A.C. Broekaert	Dr. A. von Bohlen
Dr. J. Flock	S. Hanning
Prof. Dr. M. Kreyenschmidt	Dr. E. Pappert

Formlose Anmeldung an:
Dr. Alex von Bohlen
ISAS – Institute for Analytical Sciences
Bunsen-Kirchhoff-Straße 11
44139 Dortmund
Fax: 0231/1392120
Email: vonbohlen@isas.de

Aus organisatorischen Gründen erfolgt keine schriftliche Bestätigung der Anmeldung.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Die Vorträge werden nach Abschluss der Veranstaltung auf einer CD veröffentlicht (Schutzgebühr 5 €).

6. März 2012

A. Pissenberg, Linz

Einzelfunkenanalyse am OES – Möglichkeiten für die Zukunft

J. Niederstraße, Witten

Neue Wege der Funkenemissionsanalyse durch ULB (Use fo Light Breaks

H. Dieckhues, Bocholt

Metall-Analytik / Prototypen Guss in einem mittelständischem Unternehmen/Zulieferer zur Automobil-, Elektro- und Luftfahrtindustrie

H.-G. Joosten, Kleve

Systematische Überprüfung der Messunsicherheiten von Funken-Spektrometern während der gesamten Gerätelebensdauer

R. Nehm, Unterhaching/Gelsenkirchen

Untersuchen an Zirkon und Yttrium stabilisiertem PtRh10 Legierungen mittels ICP-OES, PPMS, ETV-ICP-OES und μ -RFA

J. Wess, Hamburg

Multielementanalytik einmal anders – online und mit durchdringendem Erfolg

H. Stosnach, Berlin

Analyse archäologischer Keramikscheiben mittels Totalreflektions-Röntgenfluoreszenzanalyse

A. v. Bohlen, Dortmund

Die verbotene Farbe – ein Streifzug durch dunkle Ecken im Ruhrgebiet Ost und in Berlin

M. Haschke, Berlin

Energieauflösung vs. Zählraten – Was ist der beste Kompromiss?

U. E. A. Fittschen, M. Menzel, K.-G. Reinsberg, J. A. C. Broekaert, Hamburg

Mikroröntgenanalytik von Halbleitermaterialien und Elektroden mit der Synchrotronstrahlung

S. Noack, Berlin

Messunsicherheit bei Funken-OES und RFA – eine sichere Sache?

M. Tolan, Dortmund

Synchrotronstrahlung – Heller als die Sonne

Anschließend Möglichkeit zur Besichtigung des Dortmunder Synchrotrons Delta.

7. März 2012

P. Jackmuth, Düsseldorf

Forensische Untersuchungsmethoden

C. Shaffer, D. Bonvin, K. Juchli, Ecublens

Advanced XRF Applications Integrating Elemental Mapping and Small Spots Analysis

G. Wacker, S. Hanning, M. Kreyenschmidt, Steinfurt

Schadensfallanalytik mit einem „ μ -Detektiv“

M. Krämer, Dresden

Nanolayers for X-ray fluorescence – Development and applications

S. Mann, S. Hanning, G. Wacker, M. Kreyenschmidt, Steinfurt

Von einer, die auszog Kunststoffe zu analysieren

A. Wegner, A. Bühler, K. Behrens, Karlsruhe

Anforderungen und Lösungen für die Qualitätskontrolle mittels RFA in der Polymerindustrie

R. Schramm, Kleve

Anwendung der Norm ISO 12677:2011 zur quantitativen Analyse von Feuerfestmaterialien

S. Rivard, Kanada

Total Cement and Raw Materials Fusion / XRF Analytical Solution

M. Davidts, Brüssel

Production of prefused borate fluxes and development and application of Internal Standard Method für High Accuracy Analysis

K. Behrens, D. Porta

Wirklich simultane Röntgenfluoreszenzanalyse – Einsatz in der Metallerzeugung

C. Shaffer, D. Bonvin, P. Lemberge, Ecublens

Surprising Performance of Cost Effective XRF Instruments for Process Control Applications

D. Töwe, Engstingen

Höchste Einwiegepräzision für den automatischen Schmelzaufschluss in der RFA

M. Ostermann, Berlin

Einsatz und Eignung von RFA-Handgeräten für die Bodenanalytik

L. Füchtjohann, J. Flock, Wenden/Duisburg

Probenahme und Probenaufbereitung von Ferrolegierungen für die RFA

S. Janssen, D. Neubert, Duisburg

Semi-quantitative Analytik von Kohleschüttungen mittels Röntgenfluoreszenzanalyse

